

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Беспалов Владимир Александрович

Должность: Ректор МИЭТ

Дата подписания: 04.09.2023 11:08:55

Уникальный программный ключ:

ef5a4fe6ed0ffdf7f1a49d6ad1b49464dc1bf7354f736d76c8f68bea882b8d602

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Современные методы исследования материалов электронной техники»

Направление подготовки 28.04.03 «Наноматериалы»

Направленность (профиль) - «Инженерия наноматериалов для сенсорики»

Уровень образования - магистратура

Форма обучения - очная

1. Цель изучения дисциплины - формирование у магистров необходимых профессиональных и специальных компетенций, позволяющих применять полученные знания и практические навыки для исследования материалов электронной техники.

Задачи дисциплины: научить студентов разбираться в теоретическом материале, связанном с физическими основами методов исследования состава, структуры и электрофизических свойств материалов электронной техники; обеспечить студентов знаниями, необходимыми для грамотного выбора метода исследования объекта; сформировать умения и навыки постановки и проведения экспериментов с использованием современных методов исследования материалов; научить интерпретировать полученные экспериментальные результаты; ознакомить с современными приборами и аппаратурой; научить работе в малой исследовательской группе.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Изучению дисциплины предшествует формирование компетенций в дисциплинах бакалавриата: «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Физика» (Механика. Термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная физика) «Химия», «Кристаллография», «Метрология, стандартизация и технические измерения», «Технологии наноматериалов», «Физика и химия полупроводников», «Методы исследования наноматериалов и структур».

Данная дисциплина связан с дисциплиной «Актуальные проблемы современной науки и техники». Формируемые в процессе изучения модуля компетенции в дальнейшем углубляются выполнением индивидуальных заданий НИР и практики и служат основой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: правила написания рецензии на научную публикацию или аннотации к научной статье; основы электронной зондовой микроскопии; спектральных методов анализа; методов измерения геометрических параметров, основы международных стандартов оценки параметров материалов и структур

Уметь: критически анализировать предоставленную информацию по тематике образовательной программы при рецензировании научной публикации; подготовить развернутую аннотацию к научной публикации, выбрать наиболее подходящий метод исследования геометрических параметров и состава материалов и структур

Приобрести **опыт** рецензирования предоставленной информации для научной публикации; решения практико-ориентированных задач по применению методов элементного анализа

3. Краткое содержание дисциплины

Дисциплина включает в себя 2 раздела:

1. «Специфика исследования материалов электронной техники. Международные стандарты контроля параметров материалов электронной техники»,

2. «Спектральные методы анализа элементного состава материалов электронной техники».

Разработчик:

Доцент Института ПМТ, к.т.н., доцент Матына Л.И.